Annealing Temperature Dependence of Exchange Bias Field in MnIr-CoFe Thin Films

Seok Soo Yoon and Dong Young Kim*

Department of Physics, Andong National University, Andong 36729, Korea

(Received 7 October 2021, Received in final form 29 November 2021, Accepted 2 December 2021)

We analyzed the annealing temperature (T_a) dependence of exchange bias field (H_{EB}) in exchange coupled CoFe-MnIr thin films. The H_{EB} were increased up to $T_a = 300$ °C and then decreased at $T_a < 300$ °C. The increase of H_{EB} at $T_a < 300$ °C was explained by the rearrangement of uncompensated spin by thermal activation. While, the decrease of H_{EB} at $T_a > 300$ °C was explained by the Mn interdiffusion. These thermal annealing effect contributed to the thermal stability of H_{EB} maintaining constant values up to annealing temperature.

Keywords : exchange bias, uncompensated spin, Mn interdiffusion, thermal annealing

CoFe-MnIr 박막에서 교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성 연구

윤석수 · 김동영*

안동대학교 물리학과, 경북 안동시 경동로 1375, 36729

(2021년 10월 7일 받음, 2021년 11월 29일 최종수정본 받음, 2021년 12월 2일 게재확정)

교환 결합력을 갖는 CoFe-MnIr 박막의 교환 바이어스 자기장 H_{EB} 는 열처리 온도 $T_a = 300$ °C까지 증가한 후 감소하는 경향을 보였다. $T_a < 300$ °C에서 열처리 온도에 따른 H_{EB} 의 증가는 열적 활성화에 의한 비상보성 스핀의 정렬로 설명하였으며, $T_a > 300$ °C에서 보인 H_{EB} 의 감소는 Mn의 열확산으로 설명하였다. 이러한 열처리는 교환 바이어스 자기장을 열처리 온도까지 일정하 게 유지하는 열적 안정화에 기여하고 있음을 알 수 있었다.

주제어 : 교환 바이어스, 비상보성 스핀, Mn 열확산, 열처리

I.서 론

교환 결합력을 갖는 강자성/반강자성(F/AF) 박막은 계면에 존재하는 비상보성 반강자성 스핀의 영향으로 자화 곡선이 한 쪽으로 치우친 교환 바이어스(exchange bias) 특성을 보인다. 이러한 교환 바이어스 특성은 하드디스크 드라이브의 읽기 헤 드에 적용된 거대 자기저항 또는 터널링 자기저항 소자의 출 력 신호를 안정화시키는 고정층에 이용되고 있으며, 현재는 스핀트로닉스 분야의 다양한 응용제품에 활용되고 있다[1-3]. 교환 결합력을 갖는 F/AF 박막은 교환 바이어스 현상뿐만 아니라 AF 박막의 특성에 따라 다양한 현상이 보고되고 있

다. 자화 곡선에서 나타나는 보자력의 증가 및 Training 효과 [4], 토크 곡선에서 나타나는 회전 손실(Rotational loss)[5,6],

© The Korean Magnetics Society. All rights reserved. *Corresponding author: Tel: +82-54-820-5445, Fax: +82-54-823-1628, e-mail: dykim@andong.ac.kr 강자성 공명 신호에서 나타나는 회전 등방성(Rotatable anisotropy) 에너지[7-9] 등 측정 방법에 따라 서로 다른 현 상으로 부르고 있다.

교환 바이어스 특성은 F 박막의 두께에 반비례하며, AF 박막의 두께가 임계 두께 이상에서 나타난다[10]. AF 박막의 두께가 임계 두께 이하에서는 회전 등방성 에너지 특성이 나 타난다. 따라서 교환 바이어스 특성을 증가하기 위한 조건은 (1) F 박막의 두께는 얇고, (2) AF 박막의 두께는 임계 두께 이상이어야 한다. 이러한 교환 바이어스 특성은 열처리 및 AF의 결정 방향 등에 의존한다. 특히 교환 바이어스 특성은 열처리 온도에 따라 커다란 변화를 보이고 있으며[11], 이에 대한 원인 분석 결과는 아직 미미하다.

본 연구에서는 열처리에 따른 교환 바이어스 특성을 분석 하기 위하여 충상 구조가 다른 MnIr/CoFe (F-top) 및 CoFe/ MnIr(F-bottom) 박막을 사용하였으며, 열처리 온도에 따른 교 환 바이어스 자기장을 비교 분석하였다.



Fig. 1. (Color online) Layer structure of exchange coupled (a) MnIr/ CoFe and (b) CoFe/MnIr thin films, respectively.

II. 실험 방법

Fig. 1에서 보인 교환 결합력을 갖는 MnIr(10 nm)/CoFe (30 nm) 및 CoFe(30 nm)/MnIr(10 nm) 박막은 DC 마그네트 론 스퍼터링 방법을 사용하여 열산화막이 있는 Si 기판 위에 상온에서 증착하였다. 박막 증착 과정 동안 30 Oe의 자기장 을 인가하였다. 하지층은 Ta(5 nm)/Ru(5 nm)를 증착하였으며, 박막 표면의 산화를 방지하기 위한 보호층은 Ru(5 nm)/ Ta(5 nm)를 증착하였다.

박막의 열처리는 열처리 온도 *T_a* = 150, 200, 250, 300, 350 °C에서 1시간 동안 진행하였다. 열처리는 금속 박막의 산 화를 방지하기 위하여 진공에서 진행하였으며, 교환 바이어스 자기장을 유도하기 위하여 1 kOe의 자기장에서 진행하였으며, 냉각 동안 자기장을 유지하였다. 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 특성을 분석하기 위하여 열처리는 2단계로 진행하였다. 1단계는 스퍼터링 장치로 제조한 박막(as-deposited)에 대한 1차 열처리이고, 2단계는 *T_a* = 300 °C에서 열처리된 박막 에 대한 2차 열처리였다. 열처리된 박막은 VSM을 이용하여 자화 곡선을 측정하였다.

III. 실험 결과 및 고찰

1. As-deposited 박막의 자화 곡선

강자성 박막의 자화 곡선은 보자력을 갖는 대칭적인 자기 이력 특성을 보인다. 그러나 교환 결합력을 갖는 강자성/반강 자성 박막은 계면의 비상보성 반강자성 스핀에 의하여 자기 장 바이어스가 걸린 것과 같은 자화 곡선을 보인다. 이러한 바이어스 자기장은 강자성/반강자성 계면의 교환 결합력이 원 인이므로 교환 바이어스 자기장이라고 한다.

Fig. 2는 as-deposited MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막의



Fig. 2. (Color online) M-H loop for as-deposited MnIr/CoFe (red line) and CoFe/MnIr (blue line) thin films.

자화 곡선을 보인 것이다. 자화 곡선으로부터 구한 asdeposited MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막 각각에 대한 교환 바이어스 자기장 *H_{EB}* = 43.6 Oe, 58.3 Oe이었으며, asdeposited 박막의 교환 바이어스 자기장은 MnIr/CoFe 박막이 CoFe/MnIr 보다 15.3 Oe 작게 나타났다. 이들 As-deposited MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막의 열처리에 따른 교환 결합 력을 분석하기 위하여 교환 바이어스 자기장의 1차 열처리 온도 의존성을 측정하였다.

2. As-deposited 박막의 열처리 효과

Fig. 3(a)는 MnIr/CoFer 구조를 갖는 as-deposited 박막의 1차 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화 특성을 보인 것이다. 교환 바이어스 자기장은 as-deposited 박막의 $H_{EB} = 43.6$ Oe에서 시작하여 열처리 온도에 따라 급격하게 증가하는 경향을 보였으며, $T_a = 300$ °C에서 교환 바이어스 자기장의 최댓값 $H_{EB}^{Max} = 136.4$ Oe를 보인 후 감소하는 특성을 보였다. Fig. 3(b)는 CoFe/MnIr 구조를 갖는 as-deposited 박막의 1차 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화 특성을 보인 것이다. 교환 바이어스 자기장은 as-deposited 박막의 $H_{EB} = 58.3$ Oe에서 시작하여 열처리 온도에 따라 조금 증가하는 경향을 보였으며, $T_a = 300$ °C에서 최댓값 $H_{EB}^{Max} = 67.9$ Oe를 보인 후 조금 감소하는 특성을 보였다.

MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막 모두는 T_a = 300 °C까지 열처리 온도에 따라 교환 바이어스 자기장이 증가하는 특성 을 보였다. 이러한 특성은 반강자성 박막의 계면에 존재하는 무작위 방향의 비상보성 스핀들이 고온 자기장 열처리 과정 에서 강자성 박막의 자화 반대 방향으로 정렬하는 열적 활성 화(thermal activation) 특성으로 분석되고 있다[11]. 이러한 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 증가 경향을 살



Fig. 3. (Color online) Annealing temperature dependence of H_{EB} in (a) as-deposited MnIr/CoFe thin film and (b) as-deposited CoFe/MnIr thin film, respectively. The red lines were fitted by Eq. (1).

펴보기 위하여 온도에 따라 증가 특성을 갖는 다음의 곡선을 활용하였다.

$$H_{EB} = (H_{EB}^{Max} - \Delta) + \frac{\Delta}{1 + e^{-\alpha(T_a - T_{act})}}$$
(1)

여기서 H_{EB}^{Max} 는 열처리 과정에서 얻은 교환 바이어스 자기장 의 최댓값, Δ 는 열처리 과정에서 변화된 교환 바이어스 자기 장, α 는 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화율 을 결정하는 상수, T_{act} 는 교환 바이어스 자기장의 변화율이 가장 큰 온도이다.

Fig. 3(a)에서 보인 붉은색 실선은 MnIr/CoFe 박막에 대한 교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성을 식(1)로 fitting 결과가 실험 결과와 일치하도록 $H_{EB}^{Max} = \Delta = 142.2$ Oe, $\alpha = 0.027$ 및 $T_{act} = 170$ ℃를 각각 적용하였다. MnIr/CoFe 박막은 반강자성 박막 위에 강자성 박막을 증착하므로 MnIr 박막의 비상보성 스핀은 임의의 방향으로 정렬하여 as-

deposited 박막의 교환 바이어스 자기장은 0이 될 것으로 예 상하여, $\Delta = H_{EB}^{Max}$ 로 정하였다. Fitting 결과로부터 MnIr/CoFe 박막에서 비상보성 스핀의 정렬이 가장 활발하게 일어나는 온 도 $T_{act} = 170$ °C이며, 비상보성 스핀의 정렬은 $T_a = 300$ °C까 지 점진적으로 진행되었음을 알 수 있었다.

Fig. 3(b)에서 보인 붉은색 실선은 CoFe/MnIr 박막에 대한 교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성을 식(1)로 fitting 결과가 실험 결과와 일치하도록 $H_{EB}^{Max} = 67.9$ Oe, $\Delta = 9.5$ Oe, $\alpha = 0.04$ 및 $T_{act} = 255$ °C를 적용하였다. CoFe/MnIr 박막은 강자성 박막 위에 반강자성 박막을 증착하므로 비상 보성 스핀은 강자성 박막의 자화 방향과 반대 방향으로 박막의 증착 과정 동한 이미 정렬한 것으로 예상된다. As-deposited 박막의 교환 바이어스 자기장이 $H_{EB} = 58.3$ Oe로 측정되었고, 교환 바이어스 자기장의 열처리 의존성은 $\Delta = 9.5$ Oe로 미미 하게 측정되었음을 예측할 수 있다. Fitting 결과로부터 CoFe/MnIr 박막의 T_{act} 는 MnIr/CoFe 박막보다 높은 $T_{act} = 255 °C$ 이었으며, 이는 비상보성 스핀의 정렬이 활발하게 일어나는 온도가 박막의 구조에 따라 다르게 나타남을 알 수 있었다. 즉, T_{act} 가 높은 CoFe/MnIr 박막은 MnIr/CoFe 박막보다 열 적 안정성이 우수함을 알 수 있었다.

Fig. 3에서 보인 것과 같이 MnIr/CoFe과 CoFe/MnIr 박막 의 교환 바이어스 자기장은 $T_a = 300$ °C에서 $H_{EB}^{Max} = 136.4$ Oe, 67.9 Oe로 측정되었으며, $T_a = 350$ °C에서 두 박막 모두 감소하는 특성을 보였다. H_{EB}^{Max} 는 MnIr/CoFe 박막이 CoFe/ MnIr 박막보다 68.5 Oe 크게 나타났다. MnIr/CoFe과 CoFe/ MnIr 박막에서 측정된 H_{EB}^{Max} 의 차이와 $T_a = 350$ °C에서 측 정된 교환 바이어스 자기장의 감소 특성을 분석하기 위하여 $T_a = 300$ °C에서 열처리한 박막을 사용하여 2차 열처리를 진 행하였다.

3. T_a = 300 °C 박막의 열처리 효과

2차 열처리 온도는 1차 열처리 온도와 같은 조건으로 수행 하였으며, 2차 열처리한 박막 각각에 대하여 자화 곡선을 측 정하여 교환 바이어스 자기장을 구하였다. MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막의 2차 열처리에 의한 교환 바이어스 자기장 특성은 Fig. 4에 보인 것과 같다.

Fig. 4(a)는 MnIr/CoFer 박막의 2차 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화 특성을 보인 것이다. 교환 바이어스 자기장은 열처리 온도 *T_a* = 300 °C까지 일정하게 유지한 후 감소하는 경향을 보였다. Fig. 4(b)는 CoFe/MnIr 박막의 2차 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화 특성을 보인 것이다. 교환 바이어스 자기장은 열처리 온도 *T_a* = 300 °C까지 일정하게 유지한 후 감소하는 경향을 보였다. 따라서 자기장 열처리는 MnIr/CoFe 및 CoFe/MnIr 박막 모



Fig. 4. (a) (Color online) Annealing temperature dependence of H_{EB} in (a) $T_a = 300 \text{ °C}$ annealed MnIr/CoFe thin film and (b) $T_a = 300 \text{ °C}$ annealed CoFe/MnIr thin film, respectively. The red lines were fitted by Eq. (2).

두 열처리 온도까지 교환 바이어스 자기장을 안정화하는 역 할을 하고 있음을 알 수 있었다.

그러나 *T_a* = 350 °C에서는 1차 열처리 과정에서 보인 것과 같이 2차 열처리에 과정 역시 교환 바이어스 자기장이 감소 하는 특성을 보였다. 이러한 감소는 Mn의 열확산(thermal interdiffusion)에 의한 영향으로 분석되고 있다[11-13]. Morales 등은 Co/MnPt 박막에서 *T_a* = 300 °C 이상에서 나타 난 교환 바이어스 자기장의 감소는 Mn이 다른 층으로의 열 확산에 의한 영향으로 분석하였다[15]. Mn의 열확산이 MnPt 계면의 Pt의 성분비 증가를 야기하여 MnPt와 Co의 교환 결 합력을 약화하는 원인으로 해석하였다. Tsunoda 등도 MnIr/ CoFe 박막의 고온 열처리 과정에서 보인 교환 바이어스 자 기장의 감소를 Mn의 열확산으로 해석하였다[11].

T_a = 350 ℃ 이상에서 보인 교환 바이어스 자기장의 감소 경향을 살펴보기 위하여 온도에 따라 감소 특성을 갖는 다음 의 곡선을 사용하였다.

$$H_{EB} = \frac{H_{EB}^{Max}}{1 + e^{\beta(T_a - T_{dij})}}$$
(2)

여기서 H_{EB}^{Max} 는 열처리 과정에서 얻은 교환 바이어스 자기장 의 최댓값, f는 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 변화율을 결정하는 상수, T_{dij} 는 Mn의 열확산에 의하여 교환 바이어스 자기장의 변화율이 가장 큰 온도를 의미한다.

Fig. 4(a)에서 보인 붉은색 실선은 MnIr/CoFe 박막에 대한
교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성을 식(2)로
fitting 결과가 실험 결과와 일치하도록 H_{EB}^{Max} = 142.2 Oe, β =
0.04 및 T_{dy} = 387 °C를 적용하였다. MnIr/CoFe 박막에서
Mn의 열확산이 가장 활발한 온도 T_{dyf} = 387 °C이며, 열확산
은 비상보성 스핀을 정렬하는 T_{acr} 보다 높음을 알 수 있었다.
Fig. 4(b)에서 보인 붉은색 실선은 CoFe/MnIr 박막에 대한
교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성을 식(2)로
fitting 결과가 실험 결과와 일치하도록 H_{EB}^{Max} = 70.9 Oe, β =
0.02 및 T_{dyf} = 490 °C를 적용하였다. CoFe/MnIr 박막의 T_{dyf}
는 MnIr/CoFe 박막보다 높은 T_{dyf} = 490 °C이었으며, 이는
Mn의 열확산이 활발하게 일어나는 온도가 박막의 구조에 따
라 다르게 나타남을 알 수 있었다. 즉, T_{dy} 가 높은 CoFe/MnIr 박막은 MnIr/CoFe 박막보다 열적 안정성이 우수함을
알 수 있었다.

교환 바이어스 자기장의 열처리 온도 의존성에 대한 fitting 결과로부터 MnIr-CoFe 박막은 비상보성 스핀의 정렬에 의한 증가가 먼저 일어나고, 그 후 열확산에 의한 감소가 진행됨 을 알 수 있었다. CoFe/MnIr 박막은 MnIr/CoFe 박막보다 열확산이 높은 온도에서 일어나므로 열적 안정도가 높은 특 성을 갖는 박막임을 재차 확인할 수 있었다.

강자성-반강자성 계면 Mn의 감소는 교환 바이어스 자기장 의 감소를 유발한다[14]. Fig. 4에서 보인 것과 같이 MnIr/ CoFe과 CoFe/MnIr 박막의 H_{EB}^{Max} 차이는 Mn의 감소 영향으 로 볼 수 있다. 계면 Mn의 감소는 박막의 층착 과정에서 발 생한 것으로 짐작할 수 있다. CoFe/MnIr 박막의 MnIr 증착 과정에서 무거운 원소인 Ir의 증착이 Mn보다 빠르게 진행되 어 Mn의 양이 감소하고, Mn의 감소가 H_{EB}^{Max} 를 약 50% 감 소시킨 원인으로 볼 수 있다. 이렇듯, Mn의 감소는 교환 바 이어스 자기장의 감소를 유발하지만, 바이어스 자기장의 열적 안정화에도 크게 기여하고 있음을 알 수 있었다. 증착 과정 에서 Mn이 감소한 CoFe/MnIr 박막은 MnIr/CoFe 박막보다 교환 바이어스 자기장은 작지만, 온도의 영향이 적은 안정한 구조이다. 따라서 온도 따른 열적 안정성을 요구하는 자기저 항 소자의 고정층에는 CoFe/MnIr 구조가 유용하게 적용될 수 있다. - 300 -

IV. 결 론

본 연구에서는 교환 결합력을 갖는 CoFe-MnIr 박막의 열처 리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장 특성을 분석하기 위하여 1차 및 2차 열처리를 수행하였다. 1차 열처리는 as-deposied 박막을 이용하였으며, 2차 열처리는 T_a = 300 ℃에서 열처리 한 박막을 이용하였다. 1차 열처리를 수행한 CoFe-MnIr 박 막은 열처리 온도가 증가함에 따라 교환 바이어스 자기장이 증가하다가 T_a = 300 ℃ 이상에서 감소하는 경향을 보였다. T_a < 300 ℃에서 열처리 온도에 따른 교환 바이어스 자기장의 증가는 무작위로 배열된 비상보성 스핀의 정렬 과정으로 열 적 활성화 함수를 활용하여 설명하였다. 2차 열처리를 수행 한 CoFe-MnIr 박막은 1차 열처리 온도인 T_a = 300 ℃까지 교환 바이어스 자기장이 유지되는 특성을 보였으며, 이는 열 처리에 의한 열적 안정성이 열처리 온도까지 유지됨을 확인 할 수 있었다. 한편 T_a > 300 ℃에서 보인 교환 바이어스 자 기장의 감소 특성은 고온에서 일어나는 Mn 확산으로 설명하 였다.

본 연구를 통하여 Mn의 감소는 교환 바이어스 자기장의 감소를 유발하지만, 바이어스 자기장의 열적 안정화에도 크게 기여하고 있음을 알 수 있었다. 증착 과정에서 Mn이 감소한 CoFe/MnIr 박막은 MnIr/CoFe 박막보다 교환 바이어스 자기 장은 작지만, 온도의 영향이 적은 안정한 구조이다. 따라서 열적 안정성을 요구하는 자기저항 소자의 고정층에는 CoFe/ MnIr 구조가 유용하게 적용될 수 있다.

감사의 글

이 논문은 안동대학교 기본 연구 지원 사업에 의하여 연구 되었습니다.

References

- G. Binasch, P. Grunberg, F. Saurenbach, and W. Zinn, Phys. Rev. B 39, 2489 (1989).
- [2] S. S. Parkin, C. Kaiser, A. Panchula, P. M. Rice, B. Hughes, M. Samant, and S. H. Yang, Nature Mat. 3, 862 (2004).
- [3] S. Yuasa, T. Nagahama, A. Fukushima, Y. Suzuki, and K. Ando, Nature Mat. 3 868 (2004).
- [4] D. Y. Kim, S. S. Yoon, C. G. Kim, M. Tsunoda, and M. Takahashi, IEEE Trans. Magn. 45, 3865 (2009).
- [5] M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, T. Hashimoto, and M. Takahashi, J. Appl. Phys. 87, 4375 (2000).
- [6] D. Y. Kim and S. S. Yoon, J. Korean Magn. Soc. 24, 140 (2014).
- [7] R. D. McMichael, M. D. Stiles, P. J. Chen, and W. F. Egelhoff, Phys. Rev. B 58, 8605 (1998).
- [8] J. Geshev, L. G. Pereira, and J. E. Schmidt, Phys. Rev. B 66, 134432 (2002).
- [9] L. Wee, R. L. Stamps, L. Malkinskil, and Z. Celinski, Phys. Rev. B 69, 134426 (2004).
- [10] T. Sato, M. Tsunoda, and M. Takahashi, J. Appl. Phys. 95, 7513 (2004).
- [11] M. Tsunoda, T. Sato, T. Hashimoto, and M. Takahashi, Appl. Phys. Lett. 84, 5222 (2004).
- [12] M. J. Kim, H. J. Kim, K. Y. Kim, S. H. Jang, and T. Kang, J. Magn. Magn. Mater. 239, 195 (2002).
- [13] E. H. Morales, Y. Wang, D. Lederman, A. J. Kellock, and M. J. Carey, J. Appl. Phys. 93, 15 (2003).
- [14] M. Tsunoda, S. Yoshitaki, Y. Ashizawa, D. Y. Kim, C. Mitsumata, and M. Takahashi, Phys. Stat. Sol. (b) 244, 4470 (2007).